



บทที่ 5

การปรับขนาดขั้นเวลาอัตโนมัติ

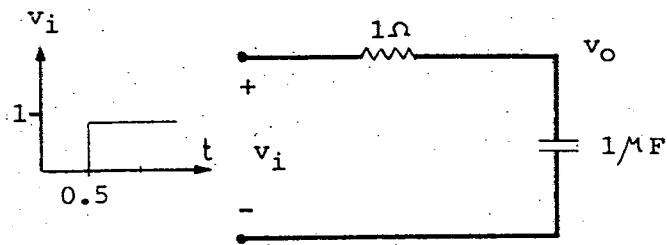
5.1 ประโยชน์ของการใช้ขนาดขั้นเวลาที่เปลี่ยนได้อย่างเหมาะสม

ในบทที่ 3 เราได้กล่าวไว้แล้วว่า การประมาณอนุพันธ์อันดับหนึ่งด้วยวิธี Backward Euler นั้น ความแม่นยำในการประมาณอนุพันธ์จะมากขึ้นถ้าขั้นเวลา h มีขนาดเล็กลง ซึ่งหมายถึงจำนวนจุดเวลาในช่วงเวลาที่ต้องการหาค่าตอบก็จะมีมากขึ้น เวลาที่ใช้ในการคำนวณก็ต้องมากขึ้นตามไปด้วย

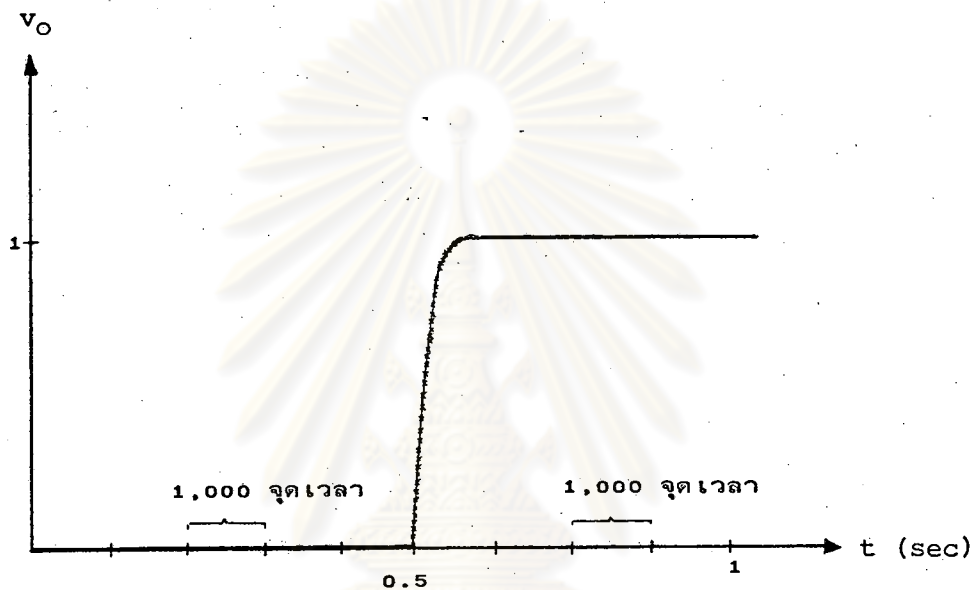
ขนาดที่เหมาะสมของขั้นเวลา h ขึ้นกับลักษณะการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของตัวแปรสถานะ $x(t)$ ที่เราประมาณอนุพันธ์ของมันนั่นเอง ถ้า $x(t)$ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว h ก็ควรมีค่าน้อยๆ และในทางกลับกัน ถ้า $x(t)$ เปลี่ยนแปลงช้าๆ h ก็มีค่ามากๆ ได้

สำหรับวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยทั่วไปแรงดันและกระแสจะมีการเปลี่ยนแปลงเร็วบ้างช้าบ้างตามการเปลี่ยนแปลงของแรงดันและกระแสขาเข้า และการเปลี่ยนแปลงภายในตัววงจรเอง ดังนั้นถ้าเราให้ขนาดขั้นเวลามีค่าคงที่ตลอดช่วงเวลา $[0, T]$ ที่ต้องการคำนวณแล้ว เราจำเป็นต้องกำหนดค่าของ h โดยพิจารณาจากช่วงที่ตัวแปรสถานะของวงจรมีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด ตัวอย่างเช่นวงจร RC ในรูปที่ 5.1(ก) ซึ่งมีแรงดันขาเข้าเป็น unit step function ช่วงเวลาที่แรงดันขาออก v_o เกิดการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดคือช่วงเวลา $0.5 < t < 0.5001$ วินาที ดังนั้นเราควรต้องให้ h มีค่าเป็นหนึ่งในสิบของช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อให้ได้ค่าตอบที่ใกล้เคียงกับค่าคำตอบจริง แต่ถ้าเราทำการคำนวณหาค่าตอบโดยใช้ h คงที่ตลอดช่วงเวลา 0 ถึง 1 วินาทีแล้ว จำนวนจุดเวลาที่ต้องทำการคำนวณจะมีมากถึง 10000 จุด ซึ่งถ้าแต่ละจุดใช้เวลาคำนวณ 1 วินาที การคำนวณในช่วงเวลา 0 ถึง 1 วินาที จะใช้เวลาทั้งหมดถึง 2.7 ชั่วโมง!

จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าการแบ่งจุดเวลาอย่างมากมายในช่วงที่ v_o เปลี่ยนแปลงน้อยๆ หรือไม่เปลี่ยนแปลงเลยนั้น แม้ว่าค่าคำตอบ v_o ที่ได้จะมีความถูกต้องมาก แต่ค่าตอบที่ได้ก็แทบไม่แตกต่างกับการใช้ h ค่ามากๆ (เช่น 0.05 วินาที) สำหรับการคำนวณในช่วงเวลานี้เลย ดังนั้นการวิเคราะห์วงจรโดยใช้ขั้นเวลาที่มีขนาดคงที่ตลอดช่วงเวลาที่ต้องการวิเคราะห์นั้น จะทำให้เราต้องใช้ขั้นเวลาที่มีขนาดเล็กมากเกินความจำเป็นต่อการคำนวณในช่วงที่วงจรมีผลตอบสนองเชิงเวลาเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ ทำให้เสียเวลาในการคำนวณมากโดยไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควร ที่สำคัญคือเรายังไม่สามารถทำนายได้ว่าวงจรอิเล็กทรอนิกส์นั้นจะมีผลตอบสนองเชิงเวลาของวงจรเปลี่ยนแปลงในช่วงไหนมากและมีอัตราการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด ดังนั้นการกำหนดค่า h ให้พอเหมาะล่วงหน้า จึงเป็นเรื่องยากและอาจเป็นไปได้เลยสำหรับบางวงจร



(ก)

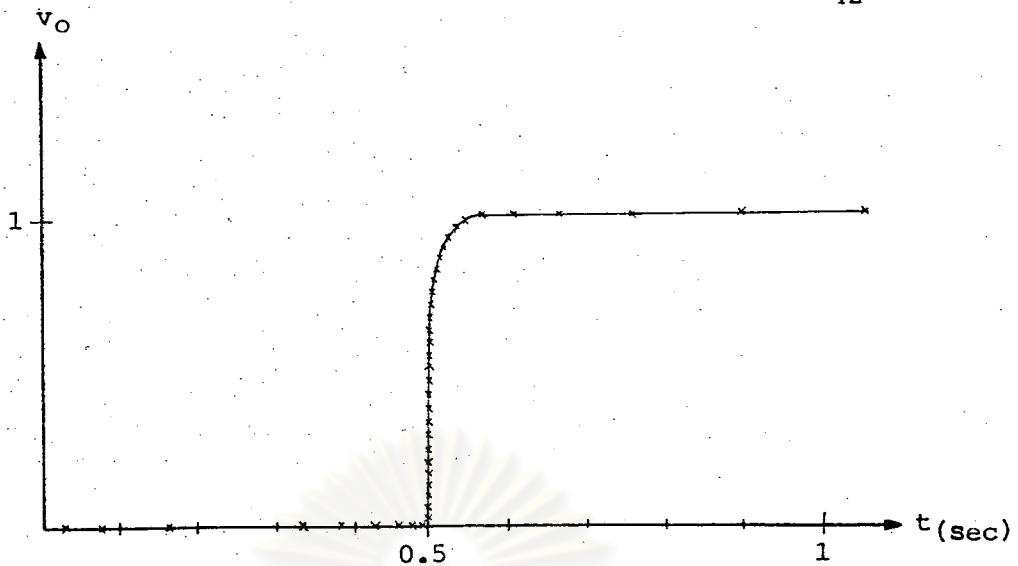


(ข)

รูปที่ 5.1 ตัวอย่างการคำนวณวงจร RC ที่ใช้ h คงที่

ปัญหาทั้งหลายที่กล่าวมาสามารถแก้ไขได้ถ้าเราให้ขนาดขั้นเวลา h เปลี่ยนแปลงได้มากขึ้นตามผลตอบสนองเชิงเวลาของวงจร ยกตัวอย่างวงจรในรูปที่ 5.1(ก) เมื่อให้ค่า h เปลี่ยนแปลงได้ จุดเวลาในการคำนวณจะมีลักษณะคล้ายกับรูปที่ 5.2 จะเห็นว่าจำนวนจุดเวลาที่ใช้คำนวณในช่วง 0 ถึง 1 วินาที จะมีเพียงประมาณ 30 จุด ซึ่งจากผลการทดลองจะได้รับความผิดพลาดในการคำนวณไม่เกิน 0.02 โวลต์ และถ้าแต่ละจุดเวลาต้องใช้เวลาในการคำนวณ 1 วินาที แบบเดียวกับในรูปที่ 5.1 แล้ว การคำนวณจะใช้เวลาเพียง 30 วินาที เท่านั้น

ในบทนี้จะได้กล่าวถึงกรรมวิธีและขบวนการในการปรับขนาดขั้นเวลาอัตโนมัติโดยอาศัยการพิจารณาจากความชันและอนุพันธ์อันดับสูงของตัวแปรสถานะของวงจร ซึ่งมีชื่อเรียกว่า "Local Truncation Error" หรือ LTE



รูปที่ 5.2 แสดงจุดเวลาในการคำนวณวงจรรูป 5.1(ก)
เมื่อให้ h เปลี่ยนแปลงได้

5.2 ความหมายของ LTE (Local Truncation Error)

เนื่องจากไม่มีวิธีเชิงเลขใดที่สามารถหาค่า $x(t)$ จากสมการ $\dot{x} = f(x,t)$ ได้ถูกต้องจริงๆ ออกมาได้ ถ้าเราสมมติให้ $x_{t_{n+1}}$ คือ ค่าคำตอบจริงของสมการ $\dot{x} = f(x,t)$ ที่เวลา t_{n+1} และ x_{n+1} คือค่าตอบของสมการอนุพันธ์ดังกล่าวที่ได้จากการคำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้วิธีเชิงเลขประมาณอนุพันธ์ ดังนั้นสมการ

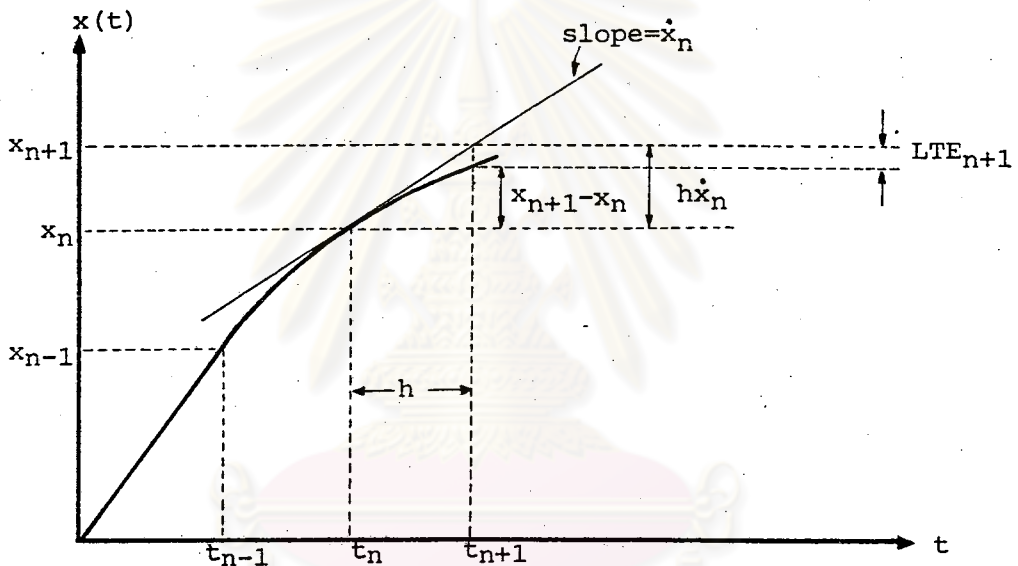
$$\epsilon_{n+1} \triangleq \|x_{t_{n+1}} - x_{n+1}\| \quad (5.1)$$

จะแทนความผิดพลาดทั้งหมด (total error) ที่เวลา t_{n+1} ความผิดพลาดนี้จะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ round-off error และ truncation error round-off error เป็นความผิดพลาดที่เกิดจากการคำนวณของเครื่องคอมพิวเตอร์เอง เนื่องจากมันไม่สามารถเก็บค่าตัวเลขจริงได้ถูกต้องและเราก็ไม่สามารถลดความผิดพลาดแบบนี้ลงได้ด้วย ส่วน truncation error หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า 'algorithmic error' เกิดจากการใช้วิธีเชิงเลขในการประมาณอนุพันธ์ ซึ่งความผิดพลาดแบบนี้เราสามารถคำนวณหาค่าโดยประมาณออกมาได้ เนื่องจาก truncation error มักมีขนาดมากกว่า round-off error มาก ดังนั้นความผิดพลาดส่วนใหญ่จึงเกิดจาก truncation error นี้เอง

เมื่อสมมติว่าเราสามารถหาค่าของ round-off error ที่จุดเวลา t_{n+1} ได้ และค่าคำตอบที่เวลาในอดีต ($t_n, t_{n-1}, \dots, t_{n-k}$) เป็นค่าคำตอบจริงแล้ว เราจะเรียกความผิดพลาดตามนิยามในสมการ (5.1) ว่า 'Local Truncation Error' หรือเรียกสั้นๆ ว่า 'LTE' ซึ่งหมายถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการคำนวณในแต่ละจุดเวลานั้นเอง เนื่องจากวิธี Backward Euler เป็นวิธีประมาณอนุพันธ์ที่ถูกต้องถึงอันดับหนึ่ง (first order approximation) เท่านั้น เราจึงสามารถพิสูจน์ [7] ได้ว่า

$$\begin{aligned} \text{LTE}_{n+1} \triangleq \| x_{t_{n+1}} - x_{n+1} \| &\approx \frac{-1h^2\ddot{x}_{n+1}}{2} \\ &\approx x_{n+1} - x_n - h\dot{x}_n \quad - (5.2) \end{aligned}$$

โดยที่ h คือขนาดขั้นเวลา \ddot{x}_{n+1} คืออนุพันธ์อันดับสองของค่าคำนวณ (computed value) ที่เวลา $t = t_{n+1}$ และ \dot{x}_n คืออนุพันธ์อันดับหนึ่งของ $x(t)$ ที่เวลา $t = t_n$ ซึ่งได้จากการประมาณอนุพันธ์ด้วยวิธี Backward Euler นั้นเอง จะเห็นได้ว่า LTE มีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับ h และการเปลี่ยนแปลงของ $x(t)$ ว่ามากหรือน้อยเพียงใด ดังแสดงในรูปที่ 5.3



รูปที่ 5.3 ลักษณะทางเรขาคณิตของการคำนวณค่า LTE_{n+1}

5.3 การเลือกขนาดขั้นเวลาโดยใช้ LTE

จากสมการ (5.2) จะเห็นว่า เราต้องคำนวณหา x_{n+1} ก่อนแล้วจึงนำมาประมาณค่าความผิดพลาดคือ LTE_{n+1} ได้ ถ้าหากความผิดพลาดนี้มีขนาดมากเกินกว่าค่าที่เรากำหนดไว้ซึ่งสมมุติว่าเป็นค่า δ แสดงว่าขั้นเวลาที่ใช้ในการคำนวณ x_{n+1} นั้นใหญ่เกินไป ต้องยกเลิก (reject) ค่าของ x_{n+1} เสียและปรับขนาดขั้นเวลาเสียใหม่ตามสูตร [7] ดังต่อไปนี้

$$\hat{h} = h \cdot \sqrt{\frac{\delta}{\text{LTE}_{n+1}}} \quad - (5.3)$$

โดยที่ \hat{h} คือขนาดขั้นเวลาใหม่ จากนั้นจึงนำขั้นเวลาใหม่นี้ไปใช้ในการคำนวณหาค่า x_{n+1} อีกครั้งหนึ่ง ค่า x_{n+1} ใหม่ที่ได้นี้ก็จะต้องถูกนำไปทดสอบความผิดพลาดตามกรรมวิธีเดิม จนกว่าจะได้ค่า LTE_{n+1} น้อยกว่าค่า δ

ในกรณีที่เราคำนวณได้ LTE_{n+1} มีค่าน้อยกว่า δ นั้น เราจะยอมรับค่า x_{n+1} และก็ยังคงใช้สมการ (5.3) ในการคำนวณหาค่าขนาดขั้นเวลาใหม่สำหรับใช้คำนวณ x_{n+2} ต่อไปด้วย ซึ่งขั้นเวลาใหม่นี้จะมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิม กรรมวิธีที่กล่าวมานี้จะทำให้เราสามารถปรับขนาดของขั้นเวลาให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงได้อย่างอัตโนมัติตามความผิดพลาดสูงสุด (6) ที่กำหนดไว้

ในทางปฏิบัติ เราอาจตัดแปลงการปรับขนาดขั้นเวลา h โดยใช้ตัวคูณประกอบ ดังนี้

$$h = w\hat{h} : \text{โดยที่ } w \leq 1 \quad (5.4)$$

การตัดแปลงนี้ จะช่วยมิให้ h ขยายใหญ่ขึ้นเร็วเกินไปในกรณีที่ LTE_{n+1} มีค่าน้อยกว่า δ มาก ขณะเดียวกัน จะทำให้ h มีขนาดเล็กลงเร็วขึ้นในกรณีที่ LTE_{n+1} มากกว่า δ ทั้งนี้เพื่อช่วยไม่ให้การคำนวณมีความผิดพลาด เกินกำหนดบ่อยครั้งจนเกินไป

เนื่องจาก LTE เกิดจากการประมาณอนุพันธ์ของอุปกรณ์พลวัตด้วยวิธีเชิงเลข ดังนั้น การหา LTE จึงคำนวณได้จากค่าที่เปลี่ยนแปลงไปของตัวแปรสถานะทุกตัวในสมการวงจรถูกพลวัต ซึ่งเป็นแรงดันคร่อมตัวเก็บประจุ และกระแสไหลผ่านตัวเหนี่ยวนำ จากสมการที่ (5.2) จะเห็นว่า เราต้องเก็บค่าของตัวแปรสถานะที่เวลา t_n (v_{Cn} และ i_{Ln}) ไว้ใช้ในการคำนวณค่า LTE ที่เวลา t_{n+1} ด้วย สำหรับอุปกรณ์ไม่เชิงเส้นเราก็ต้องเก็บภาวะของอุปกรณ์ที่เวลา t_n เพิ่มขึ้นมาอีก เพื่อให้สามารถตั้งต้นการคำนวณที่เวลา t_n ใหม่ได้อย่างถูกต้องนั่นเอง ส่วนการกำหนดค่า δ เพื่อใช้เปรียบเทียบ LTE ของแรงดันและ LTE ของกระแสก็ต้องแยกกันเพราะมีหน่วยวัดต่างกัน แต่การปรับขนาดขั้นเวลาก็จะยังคงใช้กรรมวิธีเดียวกัน

เราสามารถสรุปขั้นตอนการวิเคราะห์วงจรพลวัตที่มีการปรับขนาดขั้นเวลาอย่างอัตโนมัติได้ดังนี้

- ขั้นที่ 1) $t_{n+1} = t_n + h$
- ขั้นที่ 2) วิเคราะห์สมการวงจรถูกพลวัตที่เวลา t_{n+1} โดยวิธีประมาณอนุพันธ์
- ขั้นที่ 3) คำนวณ LTE_{n+1} และ \hat{h} สำหรับตัวแปรสถานะแต่ละตัวตามสมการ 5.2 และ 5.3 ตามลำดับ

ขั้นที่ 4) ถ้า $\hat{h} > h$ แสดงว่าใช้ได้ ให้ $h = \hat{h}$ และ $n = n+1$ ไปที่ 1)

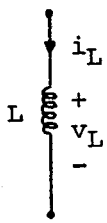
มิฉะนั้น $h = \hat{h}$ ทำการคำนวณซ้ำที่จุดเวลาเดิม ไปที่ 1)

5.4 LTE ของอุปกรณ์พลวัต

ในหัวข้อนี้เราจะกล่าวถึงการคำนวณค่า LTE สำหรับอุปกรณ์พลวัตที่ใช้ในงานวิจัยนี้ ได้แก่ ตัวเหนี่ยวนำ ตัวเก็บประจุ ออปแอมป์ และทรานซิสเตอร์ สมการที่ใช้ในการคำนวณก็คือสมการที่ (5.2) และ (5.3) ดังแสดงต่อไปนี้



ตัวเหนี่ยวนำ

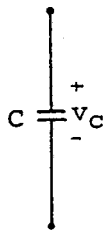


จากสมการ (5.2) จะได้

$$\begin{aligned} \text{LTE}_{n+1} &= i_{L_{n+1}} - i_{L_n} - h \dot{i}_{L_n} \\ &= i_{L_{n+1}} - i_{L_n} - \frac{h}{L} v_{L_n} \quad \text{แอมป์} \quad - (5.5) \end{aligned}$$

โดยที่ $i_{L_{n+1}}$, i_{L_n} และ v_{L_n} เป็นค่าของตัวแปรสมการวงจรถัดไป

ตัวเก็บประจุ



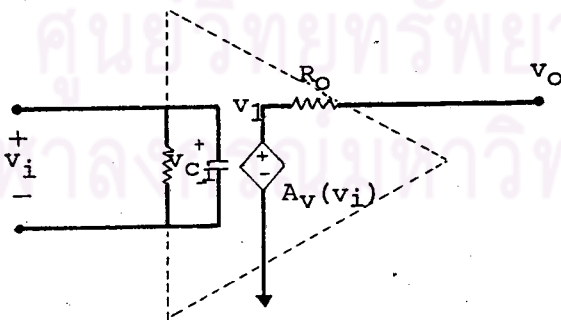
จากสมการที่ (5.2) จะได้

$$\text{LTE}_{n+1} = v_{C_{n+1}} - v_{C_n} - h \dot{v}_{C_n} \quad \text{โวลต์} \quad - (5.6)$$

$$\dot{v}_{C_n} = \frac{v_{C_n} - v_{C_{n-1}}}{h}$$

และ $v_{C_{n+1}}$, v_{C_n} และ $v_{C_{n-1}}$ เป็นค่าของตัวแปรสมการวงจรถัดไป

ออปแอมป์



เนื่องจากออปแอมป์มีตัวเก็บประจุขาเข้า (C_i) อยู่หนึ่งตัวและมีขั้วของอัตราขยายเปิดอยู่ 2 ขั้ว ดังนั้น LTE ของออปแอมป์จะมีได้ 3 ค่า คือ LTE ที่เกิดจากการประมาณอนุพันธ์ของ v_{C_i} ค่าหนึ่ง และ LTE ของการประมาณสมการอนุพันธ์ที่เกิดจากขั้วแต่ละตัวอีก 2 ค่า LTE ของ v_{C_i} สามารถหาได้โดยใช้สมการ (5.6) ส่วน LTE ของสมการอนุพันธ์เนื่องจากขั้วทั้งสองจะหาได้ดังต่อไปนี้

จากสมการด้านขวาออกของออปแอมป์ขณะอยู่ในภาวะไวงานเราได้

$$v_1 = \frac{A_0(v_i - v_j)}{(1 + s/\rho_1)(1 + s/\rho_2)} ; v_1 = v_0 + i_0 R_0 \quad (5.7)$$

ซึ่งสามารถเขียนได้ในรูปของสมการอนุพันธ์คือ

$$\frac{1}{\rho_1 \rho_2} \cdot \ddot{v}_1 + \left(\frac{1}{\rho_1} + \frac{1}{\rho_2} \right) \cdot \dot{v}_1 + v_1 = A_0(v_i - v_j) \quad (5.8)$$

เมื่อใช้ Backward Euler ประมาณอนุพันธ์ในสมการ (5.8) จะได้

$$\frac{1}{\rho_1 \rho_2} \cdot \frac{\dot{v}_{1n+1} - \dot{v}_{1n}}{h} + \left(\frac{1}{\rho_1} + \frac{1}{\rho_2} \right) \cdot \frac{v_{1n+1} - v_{1n}}{h} + v_1 = A_0(v_{in+1} - v_{jn+1}) \quad (5.9)$$

เป็นสมการเชิงเลขอันดับสอง (2nd order numerical equation) ซึ่งอยู่ในรูปแรงดันขาออกและอนุพันธ์ที่เกิดเนื่องจากขั้วทั้งสอง ดังนั้น LTE ของสมการที่ 5.9 จึงมี 2 ชุดคือ LTE ของ v_{1n+1} และ LTE ของ \dot{v}_{1n+1} แต่เนื่องจาก LTE ของ \dot{v}_{1n+1} มีหน่วยเป็นโวลต์ต่อวินาที ดังนั้นเพื่อทำให้มีหน่วยเป็นโวลต์เหมือนกัน เราจึงเปลี่ยนให้อยู่ในรูป LTE ของ $h\dot{v}_{1n+1}$

การคำนวณหา LTE ของ v_{1n+1} และ $h\dot{v}_{1n+1}$ จะมีขั้นตอนดังนี้คือ

ขั้นที่ 1: จากสมการวงจรแก่สมการหาค่าตอบ เราจะได้ค่า V_{On+1} และ I_{On+1}

ขั้นที่ 2: หา $v_{1n+1} = v_{On+1} + i_{On+1} R_0$

ขั้นที่ 3: คำนวณ \dot{v}_{1n+1} จาก $\frac{v_{1n+1} - v_{1n}}{h}$

$$\text{และ } \ddot{v}_{1n} \text{ จาก } \frac{\dot{v}_{1n} - \dot{v}_{1n-1}}{h} \cong -\frac{2v_{1n}}{h^2} + \frac{2v_{1n-1}}{h^2} + \frac{2\dot{v}_{1n}}{h}$$

ขั้นที่ 4: คำนวณ LTE ของ v_{1n+1} จาก $v_{1n+1} - v_{1n} - h\dot{v}_{1n}$ โวลต์

ขั้นที่ 5: คำนวณ LTE ของ $h\dot{v}_{1n+1}$ จาก

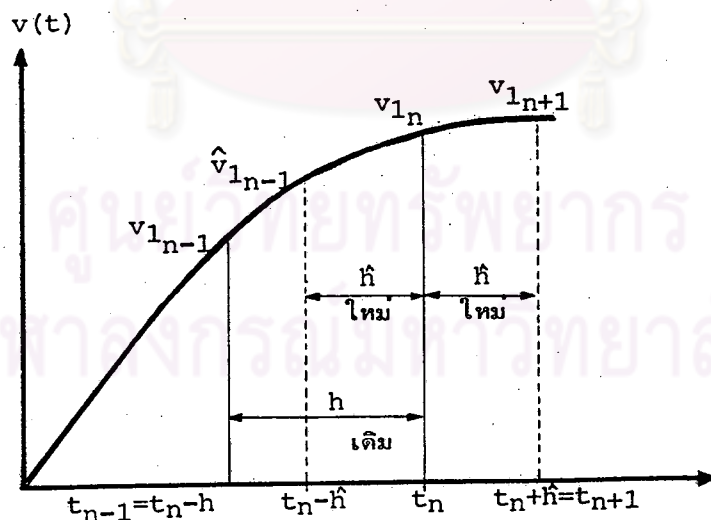
$$\begin{aligned} \text{LTE ของ } h\dot{v}_{1n+1} &= h(\dot{v}_{1n+1} - \dot{v}_{1n} - h\ddot{v}_{1n}) \\ &= v_{1n+1} - v_{1n} - h\dot{v}_{1n} + 2\hat{v}_{1n} - 2\hat{v}_{1n-1} - 2h\dot{v}_n \\ &= v_{1n+1} + v_{1n} - 2\hat{v}_{1n-1} - 3h\dot{v}_{1n} \quad \text{โวลต์} \end{aligned} \quad (5.10)$$

จากสมการที่ (5.10) จะเห็นว่าในการคำนวณหา LTE ของออปแอมป์ที่เวลา t_{n+1} ค่าที่เราต้องเก็บเพิ่มขึ้นมาจากการเก็บ v_{1n} และ \dot{v}_{1n} คือ \hat{v}_{1n-1} ในที่นี้ \hat{v}_{1n-1} หมายถึงค่าของ v_1 ที่เวลา $t_n - \hat{h}$ ซึ่งอาจไม่เท่ากับค่าของ v_1 ที่เวลา t_{n-1} ก็ได้ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงขนาดขั้นเวลาอยู่ตลอดเวลาดังแสดงเป็นตัวอย่างในรูปที่ 5.4 ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่สามารถแทนค่า \hat{v}_{1n-1} ด้วย v_{1n-1} ได้โดยตรง จำเป็นต้องคำนวณค่าของ \hat{v}_{1n-1} โดยใช้วิธี interpolation ตามสูตรดังต่อไปนี้

$$\hat{v}_{1n-1} = (1-\alpha^2)v_{1n} + \alpha^2v_{1n-1} + h(-1+\alpha)\dot{v}_{1n}$$

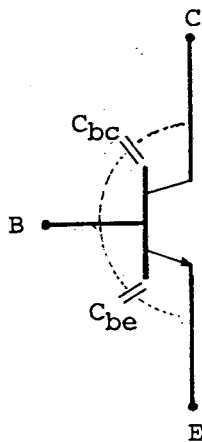
$$\text{โดยที่} \quad \alpha = \frac{t_{n+1}-t_n}{t_n-t_{n-1}} = \frac{\hat{h}}{h} \quad (5.11)$$

การที่เราต้องคำนวณค่าของ \hat{v}_{1n-1} ใหม่ทุกครั้งที่มีการปรับค่า h ทำให้เรามุ่งสนใจเฉพาะวิธีการประมาณอนุพันธ์ด้วยวิธีที่มีความถูกต้องเพียงอันดับหนึ่งอย่าง Backward Euler เท่านั้น เพราะการประมาณอนุพันธ์ที่มีความถูกต้องอันดับสูงขึ้นไปจะมีเทอมของ $v_{n-1}, v_{n-2}, \dots, v_{n-k}$ เพิ่มขึ้นตามอันดับที่สูงขึ้น ทำให้การปรับค่า h แต่ละครั้งมีขั้นตอนการคำนวณเพิ่มขึ้นมาาก จึงไม่คุ้มกับการนำมาใช้



รูปที่ 5.4 แสดงการปรับขนาดขั้นเวลาด้วยการปรับค่า \hat{v}_{1n-1}

ทรานซิสเตอร์



สำหรับทรานซิสเตอร์ อุปกรณ์พลวัตในวงจรสมมูลของมัน ก็คือตัวเก็บประจุที่รอยต่อ เบส-อิมิตเตอร์ และเบส-คอลเลกเตอร์ ดังนั้น LTE ของทรานซิสเตอร์ ก็คือ LTE ของแรงดันที่เบส-อิมิตเตอร์ และ เบส-คอลเลกเตอร์ นั่นเอง โดยที่

$$\text{LTE ของ } v_{BE_{n+1}} = v_{BE_{n+1}} - v_{BE_n} - h \cdot \dot{v}_{BE_n}$$

และ

$$\text{LTE ของ } v_{BC_{n+1}} = v_{BC_{n+1}} - v_{BC_n} - h \cdot \dot{v}_{BC_n}$$

ค่าที่ต้องเก็บไว้สำหรับการคำนวณ LTE ที่เวลา t_{n+1} ก็คือ v_{BE_n} , \dot{v}_{BE_n} , v_{BC_n} และ \dot{v}_{BC_n}

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย